

## Hot Wall Epitaxy(HWE)법에 의한 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막 성장과 점결함

홍광준

조선대학교 물리학과, 광주, 501-759 (062) 230-6637

### Growth and point defect for CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>single crystal thin film by hot wall epitaxy

Kwangjoon Hong

Department of Physics, Chosun University, Kwangju 501-759, Korea

**Abstract :** The stoichiometric mix of evaporating materials for the CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> single crystal thin films was prepared from horizontal furnace. To obtain the single crystal thin films, CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> mixed crystal was deposited on thoroughly etched semi-insulating GaAs(100) substrate by the Hot Wall Epitaxy (HWE) system. The source and substrate temperature were 630 °C and 420 °C, respectively. After the as-grown single crystal CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> thin films were annealed in Cd-, Se-, and Ga-atmospheres, the origin of point defects of single crystal CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> thin films has been investigated by PL at 10 K. The native defects of V<sub>Cd</sub>, V<sub>Se</sub>, Cd<sub>int</sub>, and Se<sub>int</sub> obtained by PL measurements were classified as donors or acceptors. And we concluded that the heat-treatment in the Cd-atmosphere converted single crystal CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> thin films to an optical p-type. Also, we confirmed that Ga in CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>/GaAs did not form the native defects because Ga in single crystal CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> thin films existed in the form of stable bonds.

**Key Words :** optimum growth condition, optical absorption, photoluminescence, point defect

### 1. 서 론

CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub>는 I-III<sub>2</sub>-VI<sub>4</sub>족 화합물 반도체로서 상온에서 에너지 띠간격이 2.5 eV 인 직접 천이형 반도체이어서 발광소자[1], 태양전지[2], LED(light emitting diode)[3], 광전도 소자[4]에 응용성이 기대되고 있어 주목되고 있는 물질이다[5,6]. 아직까지 HWE 방법으로 성장시킨 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막의 기본 물성 및 광발광 실험을 이용한 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 결정내의 점결함(point defect) 대한 연구는 되지 않았다.

본 연구에서는 합성된 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 다결정을 증발원으로 하여 HWE 방법을 이용하여 반절연성(semi-insulate:SI) GaAs(100) 기판 위에 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막을 성장시켰 성장된 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막을 Cd, Ga 및 Se 증기 분위기에서 각각 열처리한 후 광 발광 스펙트럼을 측정하고 분석하여 이러한 열처리 결과가 중성 주개에 구속된 exciton(D<sub>0</sub>,X)과 중성 발광에 구속된 exciton(A<sub>0</sub>,X)에 의한 복사 발광 봉우리 I<sub>2</sub>와 I<sub>1</sub> 및 SA emission에 의한 PL 봉우리에 어떤 영향을 미치는가를 연구하였다.

### 2. 실 험

#### 2.1. HWE에 의한 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막 성장

CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막은 진공조속의 hot wall 전기로 와 기판으로 구성된 HWE 방법을 사용하여 성장하였다. 전기로는 직경 0.4 mm tungsten wire 를 직경 35 mm 석영관에 감아 만들었으며, 전기로 둘레의 열차폐원통은 열효율을 높이기 위해 석영관에 금을 증착하여 사용하였다. 증발원은 합성된 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 다결정의 분말을 사용하였고 GaAs(100) 를 기판으로 사용하였다. CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막 성장은 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> : H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> : H<sub>2</sub>O 를 5 : 1 : 1로 chemical etching 한 GaAs(100) 기판과 증발원을 HWE 장치 속에 넣고 내부의 진공도를 10<sup>-6</sup> torr 로 배기시킨 후, CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 증발원의 온도를 630 °C, 기판의 온도를 400 ~ 440 °C로 변화 시키면서 성장하였다.

### 3. 실험 결과 및 고찰

#### 3.1. HWE에 의한 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막의 성장 조건 과 결정구조

HWE에 의한 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막 성장은 우선적

으로 반절연성 GaAs(100) 기판의 불순물을 제거하기 위하여 기판을 chemical etching하고, 증발원의 온도를 630 °C, 기판의 온도를 400~440 °C로 변화시키면서 성장시켰다. 성장된 박막들의 이중결정 X-선 요동곡선(DCRC)의 반폭치(FWHM)를 측정한 결과, 기판의 온도가 420 °C일 때 반폭치(FWHM)값이 132 arcsec로 가장 작았다. 이러한 측정 결과로부터 단결정 박막의 최적 성장 조건은 기판의 온도가 420 °C, 증발원의 온도가 630 °C임을 알 수 있었다.

### 3.2. As-grown CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막의 PL 스펙트럼

그림 1은 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막의 10K에서 PL 스펙트럼을 나타내고 있다. 그림 1에서 단파장대에서 미세한 세기의 474.5 nm(2.6128 eV)와 475.6 nm (2.6068 eV)의 광발광 봉우리는 exciton과 photon과의 상호작용으로 polariton이 생기고 free exciton의 upper polariton E<sub>UX</sub>과 lower polariton E<sub>LX</sub>로 보여진다. heavy-hole-exciton(hhx, 2.6068 eV)과 light-hole-exciton(lhx, 2.6128 eV)로 분리된다고 본다. 이때 lhx와 hhx는

$$hhx = E_g(10) - \delta E_x^{hh} \quad (1)$$

$$lhx = E_g(10) - \delta E_x^{lh} \quad (2)$$

으로 표현 된다. 10 K일 때, E<sub>g</sub>를 2.6398 eV로 하여 (2)식으로부터 구한 free exciton binding energy  $\delta E_x^{lh}$ 는 0.0270 eV로서 Bacewicz등이 reflectivity로 부터 구한 exciton binding energy인 0.0278 eV와 거의 일치한다. 474.5 nm(2.6128 eV)의 광발광 봉우리는 free exciton으로 관측되어 양질의 단결정 박막으로 성장되었음을 알 수 있었다. Bound exciton이 방사 재결합할 때 방출되는 photon의 에너지는

$$I_2(hv) = E_g - \delta E_x^{lh} - 0.15D \quad (4)$$

이다.

그림 1에서 가장 우세하게 보이는 477.0 nm(2.5991 eV) 봉우리는 중성 donor-bound exciton인 V<sub>Se</sub>에 기인하는 exciton I<sub>2</sub>(D<sub>0</sub>, X)인 것으로 생각된다. (4)식으로부터 구한 donor-bound exciton의 결합에너지는 0.0137 eV였으며, Haynes rule에 의하여  $E_{BX} / E_D \cong 0.1$  으로부터 구한 주개의 이온화 에너지는 약 0.137 eV정도임을 알 수 있다.

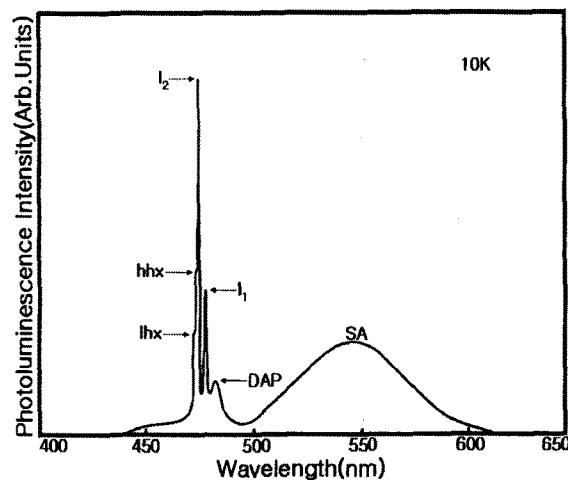


Fig. 1. 막 성장된(as-grown) CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막의 10 K에서 PL 스펙트럼

Fig. 1. Photoluminescence spectrum of as-grown single crystal CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> thin film at 10 K.

### 4. 결론

CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막을 HWE 방법으로 성장시켰다. As-grown CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 단결정 박막의 10 K일 때 PL spectrum으로부터 구한 결합에너지 free excitation binding energy  $\delta E_x^{lh}$ 는 0.0270 eV임을 알았다. 그리고, neutral selenium vacancy V<sub>Se</sub><sup>0</sup>인 주개에 구속된 exciton I<sub>2</sub>(D<sub>0</sub>, X)의 결합에너지는 0.0137 eV이다. 주개의 이온화 에너지 E<sub>D</sub>는 0.137 eV eV임을 알 수 있었다. 또 PL 측정으로부터 성장된 CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> 결정에서  $\delta E_x^{hh}$ 와  $\delta E_x^{lh}$ 와 bound 엑시톤의 존재는 성장된 결정이 양질의 단결정임을 알 수 있었다.

### 참고 문헌

- [1] G. B. Abdullav, V. G. Agaer, and E. Yu. Salaer, "Photoconductivity, Trapping, and Recombination in CdGa<sub>2</sub>Se<sub>4</sub> Single